EVIDENCA RAZISKOVALNE OPREME S PODATKI O MESEČNI UPORABI

| | | | | Polja z zelenim ozadjem so lahko objavljena na portalu SICRIS | | | |

| | | |

| | | |

795	Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo	59	P2-0120	dr. Franc Zupanič	12295	Visokoločljivi vrstični elektronski mikroskop FE SEM SIRION 400 NC z EDX mikroanalizatorjem	2005	High resolution field emission scanning electron microscope with EDX microanalyser	296.952,18	Paket 12	Uporaba je možna po predhodnem naročilu in ne vključuje stroškov materiala.	Use is possible on the basis of prior agreement	Sirion FEG je visokoločljivostni vrstični elektronski mikroskop s poljsko emisijo elektronov. Opazujemo in analiziramo lahko delce v nanometrskem območju. Sirion ima Schottkyjev izvor elektronov, kjer dobimo s poljsko emisijo elektronov curek z majhnim premerom in veliko gostoto. Rezultat je visoka ločljivost, tudi pri majhnih napetostih: 1,0 nm pri 15 kV ali 2,0 nm pri 1 kV. Mikroskop je opremljen za mikrokemično analizo z energijsko disperzijskim spektrometrom EDS Oxford INCA 350. Omogoča kvalitativno in kvantitativno mikrokemično analizo v točki in na ploskvi, ter kvalitativno linijsko analizo in ploskovno porazdelitev elementov. Analiziramo lahko elemente od berilija naprej.	Sirion FEG is a high-resolution field electron microscope with field electron emission. Particles in the nanometer range can be observed and analyzed. Sirion has a Schottky electron origin, where we obtain a small diameter electron beam and high electron density by field electron emission. The result is high resolution, even at low voltages: 1.0 nm at 15 kV or 2.0 nm at 1 kV. The microscope is equipped with energy dispersion spectrometer EDS Oxford INCA 350 for microchemical analysis. It enables qualitative and quantitative microchemical analysis in a point and on the surface, as well as qualitative line analysis and surface distribution of elements. Elements from beryllium onwards can be	44602	47,4	0	25	22,4	47,4	100	100	http://www.fs.um.si/raziskovanje/raziskovalna-oprema/	3	4	4	44	12		5	100	P2-0120	Franc Zupanič	80	ARRS - mladi raziskovalci	ARRS - mladi raziskovalci	20	IO-0029	Ivan Anžel										
795	Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo	43	P2-0157	dr. Mirko Ficko	4169	Strojnica CNC horizontalna DOOSAN LYNX 220LMA s krmiljem FANUC 0iTC+MGI	2014	Horizontal CNC lathe DOOSAN LYNX 220 LMA with control FANUC 0iTC+MGI	62.884,48	Drugi javni viri in tržni viri	Po dogovoru v LAPOS (izbenje programiranja krmilja sistema in izvajanja obdelave, tečaj od 45 do 62 ur, cena izvedbe tečaja 630 €/slušlatelja, za od 3 do 6 slušlateljev).	Use is possible on the basis of prior agreement with Laboratory for flexible manufacturing systems (for learning of CNC control and manufacturing; course of 45-62 hours; 630€ pro person; 3-6 persons).	Machining by turning and live tooling for process of drilling and milling.	Learning of CNC controls, turning and live tooling.	46980	32,9	6	4,5	22,4	32,9	100	100	http://www.fs.um.si/raziskovanje/raziskovalna-oprema/	1	8	2	46			5	100	P2-0157	Simon Klančnik	75	ARRS - mladi raziskovalci	ARRS - mladi raziskovalci	15	L2-3167	David Potočnik	10										
795	Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo	47	P2-0063	dr. Srečko Glodež	13068	Elektro-dinamični preizkusni stroj	2023	Electrodynamic Testing Machine	141118,42	Paket 21 in lastna sredstva	Uporaba opreme je možna po predhodnem dogovoru.	The equipment can be utilized with prior arrangements.	Statična in dinamična mehanska karakterizacija inženirskih gradiv.	Static and dynamic mechanical characterization of engineering materials.	48861	31	3,2	8,5	22	33,7	0,8	6,67	https://favkon.fs.um.si/equipment/	3	10	4	46	21	70	5	100	P2-0063	Branko Nečemer	50	Z2-50082	Branko Nečemer	50										
795	Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo	54	P2-0118	dr. Darinka Fakin	7004	Spektrofluriometer	2023	Spectroflurometer	44432,28	Drugi javni viri in tržni viri	Uporaba opreme je možna po predhodnem dogovoru.	The equipment can be utilized with prior arrangements.	Omogoča merjenje absorbance (230 – 1000 nm) in fluorescence (280 – 850 nm; izbor), plus spektralno skeniranje (ekstitacija in emisija). Oprema je namenjena raziskovalni dejavnosti.	Measuring the absorbance (230 – 1000 nm) and fluorescence (280 – 850 nm; selection), plus spectral scanning (excitation and emission). For research activities.	48866																5	1,41 %	P2-0118	Urška Jančič	1,41 %													